

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,

Заместитель генерального директора

ФГУ «Тест-С.Петербург»



А. П. Рагулин

2007 г.

Микроскоп исследовательский для тестирования материалов Leica DM IRM	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>35858-07</u> Взамен № _____
--	---

Изготовлен по технической документации фирмы «Leica Microsystems Wetzlar GmbH», Германия.

Зав.№ 234965.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микроскоп исследовательский для тестирования материалов Leica DM IRM (далее – микроскоп) предназначен для измерения расстояний, размеров гранул и других деталей структуры, наблюдаемых на изображении при анализе микроструктуры металлов и других материалов.

ОПИСАНИЕ

Микроскоп состоит из:

- оптической системы, состоящей из набора сменных объективов HC PL FLUOTAP 10^x, 20^x, 50^x и 100^x;
- окуляра HC RLAN 10^x/25^x;
- основания с микровинтом фокусировки на резкость изображения шкалы и объекта измерения;
- винтов регулировки диафрагмы поля зрения и настройки яркости прибора;
- предметного столика, имеющего регулировку перемещения объекта.

Изображение объекта фокусируется в поле зрения окуляра со шкалой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики микроскопа приведены в таблице.

Таблица

Объективы НС PL FLUOTAP	Цена деления, мм	Диапазон измерения, мм	Пределы допускае- мой абсолютной погрешности, мм
10 ^x	0,02	0...1,2	±0,005
20 ^x	0,01	0...0,6	±0,005
50 ^x	0,004	0...0,24	±0,002
100 ^x	0,002	0...0,12	±0,002

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 2 ;
- относительная влажность воздуха, % 65 ± 15 .

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Микроскоп Leica DM IRM - 1 шт.
2. Сменные объективы НС PL FLUOTAP 10^x, 20^x, 50^x и 100^x - по 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Методика поверки - 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка микроскопа Leica DM IRM осуществляется в соответствии с методикой поверки «Микроскоп исследовательский для тестирования материалов Leica DM IRM. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ Тест-С.-Петербург в июле 2007 г.

Основное оборудование, необходимое для поверки: объект-микрометр ОМП, 3 разряда, 0...1 мм, ЦД 0,01 мм.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

МИ 2060-90 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения длины в диапазоне $1 \cdot 10^{-6} \dots 50$ м и длин волн в диапазоне $0,2 \dots 50$ мкм».

Техническая документация фирмы «Leica Microsystems Wetzlar GmbH», Германия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип микроскопа Leica DM IRM зав.№ 234965 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма «Leica Microsystems Wetzlar GmbH», Германия.

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «286 Инженерный центр».

Адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, литер В, пом. 24Н.

Тел. (812) 303-08-46.

Директор
ООО «286 Инженерный центр»

